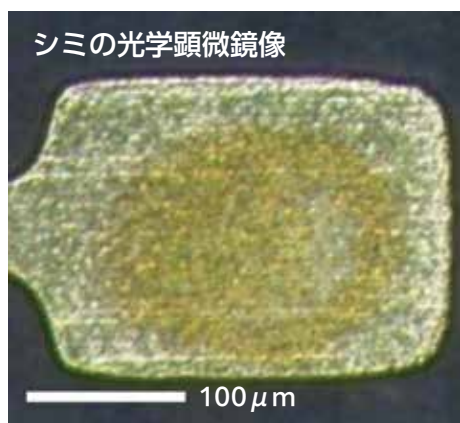


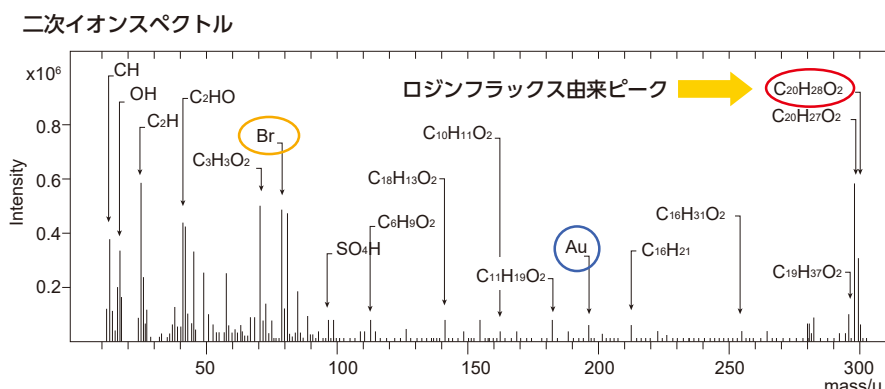
プリント配線基板上の 金パッド表面の変色原因解析

極めて微量の異物分析には、高感度、高空間分解能解析、分析深さが浅い TOF-SIMS が有効である。表面に存在する微量成分の分子構造に対応した分子イオンやフラグメント情報が得られるほか、イメージングにより元素や分子の分布情報を得ることができる。

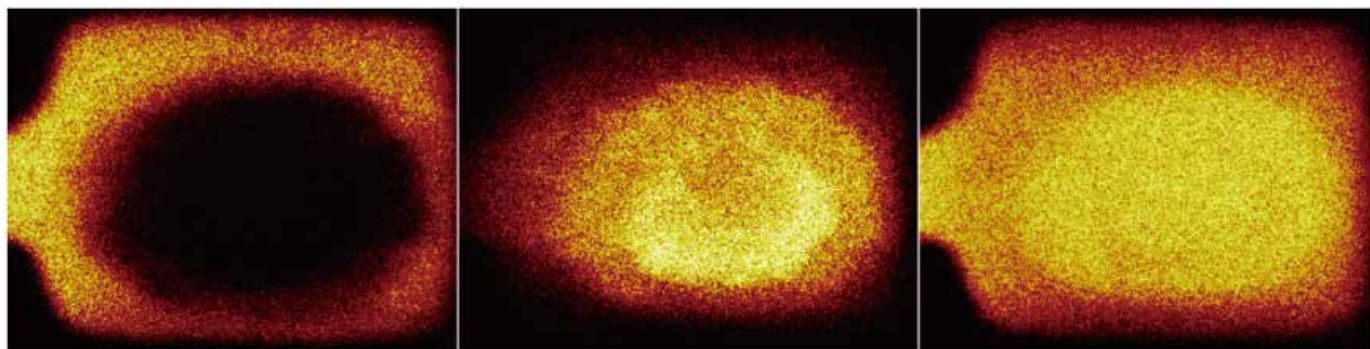
▶ 分析例 金めっき表面のしみ部



シミ（変色部）は極めて薄いため
高感度な TOF-SIMS 法が有効である



表面イメージング



Au (めっき成分)

 $C_{20}H_{28}O_2$ (フラックス成分)

Br (活性剤成分)

- ・金めっき表面しみ部の二次イオンスペクトルから、めっき表面上にフラックス成分や活性剤成分が存在していることが推測される
- ・表面イメージング像から、しみ部はめっき表面がフラックス成分や活性剤成分によって覆われていることが推測される

